

お客様各位

『X線回折ワークショップ in 東京』開催のご案内

主催：株式会社コベルコ科研

協賛：株式会社リガク

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび弊社では、株式会社リガク製 最新2次元検出器「HyPix-3000」を搭載した高機能 X 線回折装置「SmartLab」と、高出力型 X 線回折装置「RINT-TTRⅢ」を導入し、受託分析サービスを開始致しました。

新しい回折計の導入により、これまで以上に高精度な回折プロファイルを用いた同定・定量解析が可能となりました。さらにお客様のご要望にお応えすべく多様なオプション機能をご用意する事で、温度変化や応力付与中における高速動的計測を実現し、実験環境中での高精度結晶構造解析をご提案できるようになりました。

つきましては、ご愛顧頂いておりますお客様を対象に、下記ワークショップを企画いたします。新しい X 線回折装置・測定・解析技術に加え、ラボ分析～放射光技術を利用した総合分析サービスもご紹介させていただきます。さらに、著名な先生による最新 X 線技術のご講演も予定しております。またワークショップの最後には、分析の個別相談コーナーも設けさせていただきますので、ご多忙中とは存じますが、是非奮ってご来場くださいます様、お願い申し上げます。

敬具

1. 開催日時・場所

- ・2015年7月30日(木) 13:30～17:00(開場13:00)
- 品川シーズンテラス 3階カンファレンスルーム
- ◆JR品川駅 港南口(東口)より徒歩6分(新幹線・東海道線・京浜東北線・山手線・横須賀線停車)
- ◆京浜急行電鉄品川駅 高輪口より徒歩9分



2. プログラム

別紙

X線回折ワークショップ in 東京

時間	発表内容	発表者
13:30 ~ 13:40	開会ご挨拶(主催者+協賛者)	コベルコ科研東京支店 支店長 中村好規 リガク 営業本部 副本部長 宮島孝行様
13:40 ~ 14:20	特別講演 放射光回折を利用した表面、薄膜、 ナノ構造体の研究	国立開発研究法人 物質・材料研究機構 中核機能部門 高輝度放射光ステーション ステーション長 坂田修身先生
14:20 ~ 14:40	コベルコ科研におけるX線回折分析の位置づけ ・材料開発や素材不良解析などにおいて基礎情報となります結晶構造解析に用いられるX線回折法を、コベルコ科研の事業を通じご紹介いたします。	コベルコ科研高砂事業所 主幹 横山仁
14:40 ~ 15:10	X線回折装置の高度化 ・多彩な光学素子や2次元検出器を搭載したX線回折装置の特徴と測定事例をご紹介いたします。	リガク応用技術センター XRD解析グループ マネージャー 紺谷貴之様
15:10 ~ 15:20	コーヒーブレイク	
15:20 ~ 15:50	最新の実験室X線回折装置が拓く、結晶構造解析 ・リガク製の最新X線回折計を用いた材料評価・結晶構造解析の応用例をご紹介いたします。高分解能化・高速化により、高温や充放電、引張など放射光にも迫る各種 in-situ 測定が可能になりました。各種 in-situ 分析事例と、Ka1 光学系や、Co 線源の超小角測定についてもご紹介いたします。	コベルコ科研 エレクトロニクス事業部 主査 河野研二
15:50 ~ 16:20	放射光設備を活用した材料評価 ・放射光では波長選択性があり、実験室で実現不可能な XRD 実験が可能になります。また XRD では困難な非晶質材料などには、XAFS による局所構造解析や状態分析が広く用いられます。産業利用でも着目されている HAXPES にも言及し、放射光を活用した各種材料評価の事例をご紹介いたします。	コベルコ科研 エレクトロニクス事業部 主幹 北原周
16:20 ~ 16:30	閉会ご挨拶(主催者)	コベルコ科研 エレクトロニクス事業部 事業部長 由利司
16:30 ~ 17:00	個別問い合わせ、会場の展示パネルの見学・説明 (会場にコベルコ科研、リガクのパネルを展示いたします)	